

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2019年4月4日(04.04.2019)



(10) 国際公開番号  
**WO 2019/065701 A1**

- (51) 国際特許分類:  
G01N 23/046 (2018.01) G01N 23/18 (2018.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2018/035606
- (22) 国際出願日: 2018年9月26日(26.09.2018)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2017-187450 2017年9月28日(28.09.2017) JP  
特願 2017-187451 2017年9月28日(28.09.2017) JP
- (71) 出願人:株式会社サキコーポレーション(SAKI CORPORATION) [JP/JP]; 〒1350051 東京都江東区枝川三丁目1番4号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 平山 巧馬 (HIRAYAMA Takuma); 〒1350051 東京都江東区枝川三丁目1番4号 株式会社サキコーポレーション内 Tokyo (JP).  
山本 洋介(YAMAMOTO Yosuke); 〒1350051 東京都江東区枝川三丁目1番4号 株式会社サキコーポレーション内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 保坂 丈世(HOSAKA Joyo); 〒1020082 東京都千代田区一番町9-20-505 シエラ・クレアーレ特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(54) Title: INSPECTION POSITION SPECIFICATION METHOD, THREE-DIMENSIONAL IMAGE GENERATION METHOD, AND INSPECTION DEVICE

(54) 発明の名称: 検査位置の特定方法、3次元画像の生成方法、及び検査装置

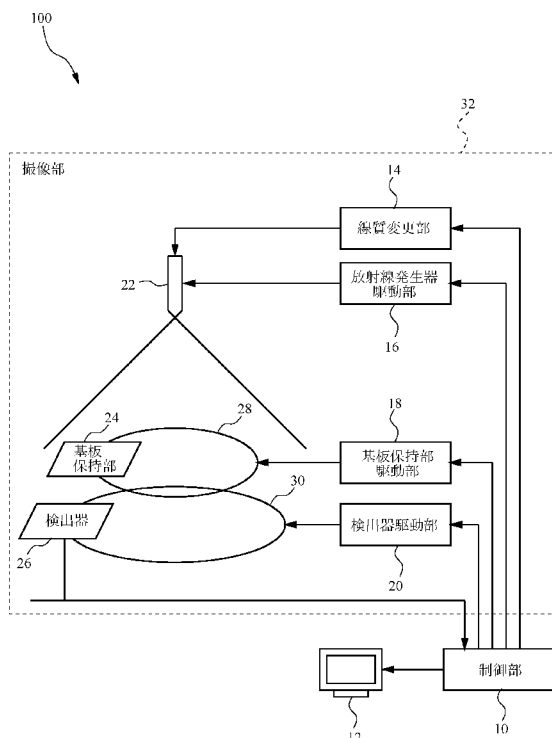


FIG. 1:  
 10 Control unit  
 14 Radiation quality modification unit  
 16 Radiation generator drive unit  
 18 Substrate holding unit drive unit  
 20 Detector drive unit  
 24 Substrate holding unit  
 26 Detector  
 100 Imaging unit

(57) Abstract: Provided are: an inspection position specification method with which accurate inspection is possible without specifying in advance the position (Z-direction position) of an inspection surface on an object to be inspected; a three-dimensional image generation method with which a three-dimensional image necessary for inspection can be generated without specifying in advance the position (Z-direction position) of an inspection surface on an object to be inspected, and with which inspection can be performed using the image; and an inspection device including these methods. An



WO 2019/065701 A1

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類 :

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

---

inspection device 100 comprises: a storage unit 34 that stores a radiation transmission image of an object to be inspected (substrate) and a three-dimensional image generated from the radiation transmission image; and a control unit 10. A process executed by the control unit 10 for specifying an inspection position in the three-dimensional image includes: a step for specifying, in the radiation transmission image, the position of a transmission image of an inspection position; and a step for specifying an inspection position in the three-dimensional image from the position of the transmission image.

(57) 要約 : 被検査対象における検査面の位置 (Z方向位置) を予め特定することなく正確な検査を行うことができる検査位置の特定方法、及び、被検査対象における検査面の位置 (Z方向位置) を予め特定することなく検査に必要な3次元画像を生成して検査を行うことができる3次元画像の生成方法、並びにこれらの方法を有する検査装置を提供する。検査装置100は、被検査体(基板)の放射線透過画像及びこの放射線透過画像から生成された3次元画像を記憶する記憶部34と、制御部10と、を有し、制御部10の3次元画像における検査位置を特定する処理は、放射線透過画像において、検査位置の透過像の位置を特定するステップと、透過像の位置から、3次元画像における検査位置を特定するステップと、を有する。

## 明 細 書

発明の名称：

**検査位置の特定方法、3次元画像の生成方法、及び検査装置**

**技術分野**

[0001] 本発明は、被検査体を検査する際の検査位置の特定方法、3次元画像の生成方法、及び、これらの方法を有する検査装置に関する。

**背景技術**

[0002] 基板表面や裏面のはんだ形状を計測する検査装置として、トモシンセシス方式のX線検査装置がある（例えば、特許文献1参照）。

**先行技術文献**

**特許文献**

[0003] 特許文献1：特開2008-026334号公報

**発明の概要**

**発明が解決しようとする課題**

[0004] しかしながら、このようなX線検査装置では、予めレーザー測長器などでZ方向（X線投射方向若しくは基板表面に対する高さ方向）の基板表面や裏面の位置を特定しておき、その高さでの断面画像を再構成する、または、再構成された断面画像の中で最適なZ方向の画像を抽出する必要がある、検査時間が長くなるという課題があった。

[0005] 本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、被検査対象における検査面の位置（Z方向位置）を予め特定することなく正確な検査を行うことができる検査位置の特定方法、被検査対象における検査面の位置（Z方向位置）を予め特定することなく検査に必要な3次元画像を生成して検査を行うことができる3次元画像の生成方法、及び、これらの方法を有する検査装置を提供することを目的とする。

**課題を解決するための手段**

[0006] 前記課題を解決するために、第1の本発明に係る検査位置の特定方法は、被検査体の放射線透過画像から生成された3次元画像における検査位置を特定する特定方法であって、放射線透過画像において、検査位置の透過像の位置を特定するステップと、透過像の位置から、3次元画像における検査位置を特定するステップと、を有することを特徴とする。

[0007] また、このような本発明に係る検査位置の特定方法において、透過像の位置を特定するステップは、検査位置または検査位置の近傍の特定のパターンやマークの透過像の形状を用いて特定することが好ましい。

[0008] また、本発明に係る検査装置は、放射線透過画像及び3次元画像を記憶する記憶部と、記憶部から放射線透過画像を取り出して、上述した検査位置の特定方法により、3次元画像における検査位置を特定する制御部と、を有することを特徴とする。

[0009] また、第2の本発明に係る3次元画像の生成方法は、被検査体の放射線透過画像から前記被検査体の3次元画像を生成する生成方法であって、放射線透過画像において、被検査体の検査位置の透過像の位置を特定するステップと、透過像の位置から、3次元画像における検査位置を特定するステップと、放射線透過画像から、検査位置を含む被検査体の3次元画像を生成するステップと、を有することを特徴とする。

[0010] また、本発明に係る3次元画像の生成方法において、透過像の位置を特定するステップは、検査位置または検査位置の近傍の特定のパターンやマークの透過像の形状を用いて特定することが好ましい。

[0011] また、本発明に係る検査装置は、放射線透過画像及び3次元画像を記憶する記憶部と、記憶部から放射線透過画像を取り出して、上述した3次元画像の生成方法により、被検査体の3次元画像を生成する制御部と、を有することを特徴とする。

## 発明の効果

[0012] 本発明に係る検査位置の特定方法によれば、被検査対象における検査面の位置（Z方向位置）を予め特定することなく、正確な検査を行うことができ

る。

### 図面の簡単な説明

- [0013] [図1]実施形態に係る検査装置の構成を示す説明図である。
- [図2]上記検査装置の制御部が処理する各機能ブロックの説明図である。
- [図3]検査の流れを説明するフローチャートである。
- [図4]再構成空間における補正量を示す説明図である。
- [図5]基板検査面の特定方法を示す説明図であって、(a)は第1の実施形態における方法を示し、(b)は第2の実施形態における方法を示す。
- [図6]2枚の透過画像から再構成画像における位置を決定する方法を説明するための説明図である。
- [図7]基板検査面の特定方法を示す説明図であって、第3の実施形態における方法を示す。
- [図8]第3の実施形態における検査の流れを説明するフローチャートである。

### 発明を実施するための形態

- [0014] 以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して説明する。図1に示すように、本実施形態に係る検査装置100は、PC等の処理装置で構成される制御部10、モニタ12、及び、撮像部32を有して構成されている。また、撮像部32は、更に、線質変更部14、放射線発生器駆動部16、基板保持部駆動部18、検出器駆動部20、放射線発生器22、基板保持部24、及び、検出器26を有している。
- [0015] 放射線発生器22は、X線等の放射線を発生させる装置であり、例えば加速させた電子をタングステンやダイヤモンド等のターゲットに衝突させることで放射線を発生するものである。
- [0016] 基板保持部24は、被検査体である基板を保持する。基板保持部24に保持された基板に放射線発生器22で発生させた放射線を照射し、基板を透過した放射線を検出器26で画像として撮像する。以下、検出器26で撮像された基板の放射線透過画像を「透過画像」と呼ぶ。なお、後述するように、本実施形態においては、基板を保持した基板保持部24と検出器26とを放

射線発生器 22 に対して相対移動させて複数の透過画像を取得して、再構成画像を生成する。

[0017] 検出器 26 で撮像された透過画像は、制御部 10 に送られ、例えば、フィルタ補正逆投影法 (Filtered-Backprojection法 (FBP法)) 等の既知の技術を用いて、接合部分のはんだの立体形状を含む画像に再構成される。そして、再構成された画像や透過画像は、制御部 10 内のストレージや、図示しない外部のストレージに記憶される。以下、透過画像に基づいて接合部分のはんだの立体形状を含む 3次元画像に再構成された画像を「再構成画像」と呼ぶ。また、再構成画像から任意の断面を切り出した画像を「断面画像」と呼ぶ。このような再構成画像及び断面画像はモニタ 12 に出力される。なお、モニタ 12 には再構成画像や断面画像のみならず、後述するはんだの接合状態の検査結果等も表示される。また、本実施形態における再構成画像は、上述したように、検出器 26 で撮像された平面画像から再構成されるため「プラナーCT」とも呼ぶ。

[0018] 線質変更部 14 は、放射線発生器 22 で発生される放射線の線質を変更する。放射線の線質は、ターゲットに衝突させる電子を加速するために印加する電圧 (以下「管電圧」と呼ぶ) や、電子の数を決定する電流 (以下「管電流」と呼ぶ) によって定まる。線質変更部 14 は、これら管電圧と管電流とを制御する装置である。この線質変更部 14 は変圧器や整流器等、既知の技術を用いて実現できる。

[0019] ここで、放射線の線質は、放射線の輝度と硬さ (放射線のスペクトル分布) とで定まる。管電流を大きくすればターゲットに衝突する電子の数が増え、発生する放射線の光子の数も増える。その結果、放射線の輝度が大きくなる。例えば、コンデンサ等の部品の中には他の部品と比較して厚みがあるものもあり、これらの部品の透過画像を撮像するには輝度の大きな放射線を照射する必要がある。このような場合に管電流を調整することで放射線の輝度を調整する。また、管電圧を高くすると、ターゲットに衝突する電子のエネルギーが大きくなり、発生する放射線のエネルギー (スペクトル) が大きく

なる。一般に、放射線のエネルギーが大きいほど物質の貫通力が大きくなり、物質に吸収されにくくなる。そのような放射線を用いて撮像した透過画像はコントラストが低くなる。このため、管電圧は透過画像のコントラストを調整するのに利用できる。

[0020] 放射線発生器駆動部 16 は、図示しないモータ等の駆動機構を有しており、放射線発生器 22 をその焦点を通る軸に沿って上下に移動させることができる。これにより放射線発生器 22 と基板保持部 24 に保持される被検査体（基板）との距離を変えて照射野を変更し、検出器 26 で撮像される透過画像の拡大率を変更することが可能となる。

[0021] 検出器駆動部 20 も図示しないモータ等の駆動機構を有しており、検出器回転軌道 30 に沿って検出器 26 を回転移動させる。また、基板保持部駆動部 18 も図示しないモータ等の駆動機構を有しており、基板回転軌道 28 が設けられた平面上を、基板保持部 24 を平行移動させる。また、基板保持部 24 は、検出器 26 の回転移動と連動して、基板回転軌道 28 上を回転移動する構成となっている。これにより、基板保持部 24 が保持する基板と放射線発生器 22 との相対的な位置関係を変更させながら、投射方向及び投射角度が異なる複数の透過画像を撮像することが可能となる。

[0022] ここで、基板回転軌道 28 と検出器回転軌道 30 との回転半径は固定ではなく、自由に変更できる構成となっている。これにより、基板に配置される部品に照射する放射線の照射角度を任意に変更することが可能となる。

[0023] 制御部 10 は、上述した検査装置 100 の全動作を制御する。以下、制御部 10 の諸機能について図 2 を用いて説明する。なお、図示されていないが、制御部 10 にはキーボードおよびマウスなどの入力装置が接続されている。

[0024] 制御部 10 は、記憶部 34、断面画像生成部 36、基板検査面検出部 38、疑似断面画像生成部 40、及び検査部 42 を含む。なお、図示しないが制御部 10 は線質変更部 14、放射線発生器駆動部 16、基板保持部駆動部 18、及び検出器駆動部 20 の作動を制御する撮像制御部も含む。また、これ

らの各機能ブロックは、各種演算処理を実行するCPU、データの格納やプログラム実行のためのワークエリアとして利用されるRAMなどのハードウェア、およびソフトウェアの連携によって実現される。したがって、これらの機能ブロックはハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせによって様々な形で実現することができる。

[0025] 記憶部34は、基板の透過画像を撮像するための撮像条件や、被検査体である基板の設計等の情報を記憶する。記憶部34はまた、基板の透過画像や再構成画像（断面画像、疑似断面画像）、及び後述する検査部42の検査結果等を記憶する。記憶部34はさらに、放射線発生器駆動部16が放射線発生器22を駆動する速度、基板保持部駆動部18が基板保持部24を駆動する速度および検出器駆動部20が検出器26を駆動する速度も格納されている。

[0026] 断面画像生成部36は、記憶部34から取得した複数の透過画像に基づいて、断面画像を生成する。これは、例えばFBP法や最尤推定法等、既知の技術を用いて実現できる。再構成アルゴリズムが異なると、得られる再構成画像の性質や再構成に要する時間も異なる。そこで、あらかじめ複数の再構成アルゴリズムやアルゴリズムに用いられるパラメータを用意しておき、ユーザに選択させる構成としてもよい。これにより、再構成に要する時間が短くなることを優先したり、時間はかかっても画質の良さを優先したりするなどの選択の自由度をユーザに提供することができる。生成した断面画像は記憶部34に出力し、この記憶部34に記録される。

[0027] 基板検査面検出部38は、断面画像生成部36が生成した複数の断面画像の中から、基板上の検査の対象となる面（例えば、基板の表面）を映し出している位置（断面画像）を特定する。以後、基板の検査面を映し出している断面画像を「検査面画像」という。検査面画像の検出方法についての詳細は後述する。

[0028] 疑似断面画像生成部40は、断面画像生成部36が生成した断面画像について、連続する所定枚数の断面画像を積み上げることにより、断面画像より

も厚い基板の領域を画像化する。積み上げる断面画像の枚数は、断面画像が映し出す基板の領域の厚さ（以後、「スライス厚」という。）と、疑似断面画像のスライス厚とによって定める。例えば、断面画像のスライス厚が $50\mu\text{m}$ で、疑似断面画像としてBGAのはんだボール（以後単に「はんだ」という。）の高さ（例えば $500\mu\text{m}$ ）をスライス厚としようとするならば、 $500/50=10$ 枚の断面画像を積み上げればよい。この際、はんだの位置を特定するために、基板検査面検出部38が特定した検査面画像が用いられる。

[0029] 検査部42は、断面画像生成部36が生成した断面画像、基板検査面検出部38が特定した検査面画像、及び疑似断面画像生成部40が生成した疑似断面画像に基づいて、はんだの接合状態を検査する。基板と部品とを接合するはんだは基板検査面付近にあるので、検査面画像及び検査面画像に対して放射線発生器22側の領域を映し出している断面画像を検査することで、はんだが基板と部品とを適切に接合しているか否かが判断できる。

[0030] ここで、「はんだの接合状態」とは、基板と部品とがはんだにより接合し、適切な導電経路が生成されているか否かのことをいう。はんだの接合状態の検査には、ブリッジ検査、溶融状態検査、及びボイド検査が含まれる。「ブリッジ (bridge)」とは、はんだが接合することにより生じた導体間の好ましくない導電経路のことをいう。また、「溶融状態」とは、はんだの溶融不足により、基板と部品との間の接合が不足しているか否かの状態、いわゆる「浮き」か否かの状態をいう。「ボイド (void)」とは、はんだ接合部内の気泡によるはんだ接合の不具合のことをいう。したがって検査部42は、ブリッジ検査部44、溶融状態検査部46、及びボイド検査部48を含む。

[0031] ブリッジ検査部44、溶融状態検査部46、及びボイド検査部48の動作の詳細は後述するが、ブリッジ検査部44およびボイド検査部48は、疑似断面画像生成部40が生成した疑似断面画像に基づいてそれぞれブリッジおよびボイドの検査をし、溶融状態検査部46は基板検査面検出部38が特定

した検査面画像に基づいてはんだの溶融状態を検査する。なお、ブリッジ検査部 4 4、溶融状態検査部 4 6、及びボイド検査部 4 8 における検査結果は記憶部 3 4 に記録される。

[0032] 図 3 は透過画像の撮像及び再構成画像の生成、及び、検査面画像の特定から、はんだの接合状態を検査するまでの流れを示したフローチャートである。本フローチャートにおける処理は、例えば、制御部 1 0 が図示しない入力装置から検査開始の指示を受け付けたときに開始する。

[0033] 制御部 1 0 は、上述したように、放射線発生器駆動部 1 6 により放射線発生器 2 2 により放射される放射線の照射野を設定し、基板保持部駆動部 1 8 により基板保持部 2 4 を移動させるとともに、検出器駆動部 2 0 により検出器 2 6 を移動させて撮像位置を変更しながら、線質変更部 1 4 により放射線発生器 2 2 の線質を設定して放射線を基板に照射して透過画像を撮像し、さらに、このようにして撮像された複数枚の透過画像から、断面画像生成部 3 6 及び疑似断面画像生成部 4 0 により再構成画像を生成する（ステップ S 1 0）。

[0034] 次に、制御部 1 0 の基板検査面検出部 3 8 は、断面画像生成部 3 6 から透過画像または再構成画像（断面画像）を受け取り、その中から検査面画像を特定する（ステップ S 1 2）。ブリッジ検査部 4 4 は、疑似断面画像生成部 4 0 からはんだボールを映し出しているはんだボールと同程度のスライス厚の疑似断面画像を取得し、ブリッジの有無を検査する（ステップ S 1 4）。ブリッジを検出しない場合には（ステップ S 1 6 の「N」）、溶融状態検査部 4 6 は基板検査面検出部 3 8 から検査面画像を取得し、はんだが溶融しているか否かを検査する（ステップ S 1 8）。はんだが溶融している場合には（ステップ S 2 0 の「Y」）、ボイド検査部 4 8 は疑似断面画像生成部 4 0 からはんだボールを部分的に映し出している疑似断面画像を取得し、ボイドが存在するか否かを検査する（ステップ S 2 2）。ボイドが見つからない場合には（ステップ S 2 4 の「N」）、ボイド検査部 4 8 は、はんだの接合状態は正常と判断し（ステップ S 2 6）、その旨を記憶部 3 4 に出力する。ま

た、ブリッジを検出した場合（ステップS16の「Y」）、はんだが溶融していない場合（ステップS20の「N」）、またはボイドが存在する場合には（ステップS24の「Y」）、それぞれブリッジ検査部44、溶融状態検査部46、およびボイド検査部48ははんだの接合状態は異常と判断して（ステップS28）その旨を記憶部34に出力する。はんだの状態が記憶部34に出力されると、本フローチャートにおける処理は終了する。

[0035] 上述したように、透過画像から再構成された3次元画像である再構成画像（再構成空間）内には、傾き、ずれ、たわみ、回転、伸縮等を起因とする誤差を有した基板の画像データが存在している。そのため、自動検査を行うためには、これらの誤差を考慮した位置補正を行い、この位置補正に基づいて検査面画像を特定する必要がある。以下に、基板検査面検出処理S12における検査位置（基板検査面）の特定方法（誤差の補正方法）について説明する。

[0036] （第1の実施形態）

検査位置の特定方法の第1の実施形態は、上述した再構成画像の生成（ステップS10）において、基板の表面と裏面を含む大きな範囲（上述した基板の反り等の誤差を考慮した範囲）でプラナーCT演算を行うことで、基板の反り等の誤差を含む3次元画像（再構成画像）を取得し、基板の設計情報を用いて、この3次元画像（再構成画像）から複数の断面画像に跨がってXYZ方向に、検査位置を特定するための特定のパターンやマークの形状（特定のパターンやマークの像）を検出して、基板検査面（検査面画像）の決定を行う。

[0037] ここで「基板の設計情報」とは、ガーバーデータ（Gerber data）およびCAD（Computer Aided Design）データのことをいい、上述した記憶部34にあらかじめ記憶しておく。はんだ接合部分の座標を記録した情報をガーバーデータといい、搭載部品の種類および搭載位置の座標を記録した情報をCADデータという。はんだの接合部分および部品の搭載位置の座標は基板上に設定されたXY座標系の座標として記載される。ガーバーデータおよびCA

Dデータを参照することで、再構成画像（断面画像）に対するイメージマッチング（パターンマッチング）等を行うことにより、基板上に存在する部品の種類やその大きさ、部品やはんだ接合部分の位置を得る、すなわち、検査位置（検査面画像）を特定することができる。

[0038] 具体的には、透過画像のFOV（Field of View:視野）毎、またはFOVを $2 \times 2$ に4分割した領域毎にテンプレートとなる基板表面画像を基板の裏表それぞれで登録する（上述したガーバーデータやCADデータを用いることができる）。そして、撮像する各基板でFOV毎に所定のXYZサーチ範囲において登録したテンプレートとイメージマッチングを行い、最も一致率の高い位置をずれ量として用いる。このようにFOV毎、若しくはFOVを4分割した領域毎にずれ量を検出することにより、1枚のFOVに対して1個または4個のずれ量を有することになり、図4に示すように、このずれ量は、基板全体に対して、三角形の頂点として表現される。そして、それぞれの三角形で囲まれた領域の検査を行う際には三角形の頂点のずれ量から補正量を計算し（基準となる面からのずれ量を計算する）、この補正量に基づいて検査面画像を決定する。三角形の頂点のずれ量を用いることで、XYZ方向のシフト及びXYZ軸に対する回転の補正が可能となる。検査箇所が複数ある場合に、それぞれの検査箇所に応じて上記誤差から断面画像を決定し、それを用いて疑似断面画像を生成して、検査し、次の検査箇所に移って同様の処理を行う。また、更に、高精度な位置補正が必要な検査対象部品に関しては、個別に位置補正を行う。この際には先にイメージマッチングで大まかには基板表面を検出しているため、サーチ範囲は限られ高速に処理を行うことができる。

[0039]（第2の実施形態）

図5（a）に示すように、第1の実施形態に係る検査位置（基板検査面）の特定方法は、透過画像から、基板の反り等の誤差を考慮した範囲の3次元画像（再構成画像）を再構成し、この3次元画像を用いて特定していたが、この第2の実施形態に係る検査位置（基板検査面）の特定方法は、図5（b

)に示すように、2以上の透過画像において特定のパターンやマークの像の形状(透過像)  $I A 1$ ,  $I A 2$ を検出し、これらの透過画像の各々における透過像のXYZの位置に基づいて、3次元画像(再構成画像)における特定のパターンやマークの形状(3次元画像における特定のパターンやマークの像) Aの位置を特定して検査面画像を決定する方法である。

[0040] 図6により、2枚の透過画像において、特定のパターンやマークの透過像(ここでは、点  $I A 1$ ,  $I A 2$ として説明する)が検出された位置から、再構成画像上の特定のパターンやマークの像Aの位置(再構成空間(再構成画像)において、特定のパターンやマークの3次元像Aがある位置)を特定する方法について説明する。なお、図1に示すように、本実施形態に係る検査装置100においては、固定された放射線源(放射線発生器22)に対して、検査対象の基板(基板保持部24)と検出器26とを相対移動させることにより、基板に対する放射線の投射角を変化させて複数枚の透過画像を撮像しているが、図6(a)においては、検査対象の基板を固定とし、放射線源(放射線発生器22)及び検出器26を移動させた場合について示している。なお、この図6における位置(座標)は、放射線源(放射線発生器22)、基板(基板保持部24)及び検出器26の検査装置100における位置(検査装置100の所定の原点からの位置)を用いて、計算により求めることができる。また、図6において、基準となる位置(基準点)をOとする。

[0041] まず、第1の投射角における放射線源の位置(放射線発生器22から放射線が放射される座標)を( $S X 1$ ,  $S Y 1$ ,  $S Z 1$ )とし、検出器26において特定のパターンやマークの透過像  $I A 1$ が検出された位置を( $D X 1$ ,  $D Y 1$ ,  $D Z 1$ )とし、再構成画像内のこの特定のパターンやマークの像Aの位置を( $O X$ ,  $O Y$ ,  $O Z$ )とする。また、第2の投射角における放射線源の位置を( $S X 2$ ,  $S Y 2$ ,  $S Z 2$ )とし、検出器26における透過像  $I A 2$ の位置を( $D X 2$ ,  $D Y 2$ ,  $D Z 2$ )とする。再構成画像内の特定のパターンやマークの像AのX方向及びY方向の位置である  $O X$ ,  $O Y$ は、図6(b)に示すように、XY平面上で放射線源と検出器上の座標とを結んだ直

線を交わる点を求めればよく、以下の連立方程式（１），（２）をOX，OYについて解くことにより求められる。

$$\begin{aligned}
 [0042] \quad OY &= (SY1 - DY1) / (SX1 - DX1) \cdot OX \\
 &+ (SX1 \cdot DY1 - SY1 \cdot DX1) / (SX1 - DX1) \\
 &(1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 OY &= (SY2 - DY2) / (SX2 - DX2) \cdot OX \\
 &+ (SX2 \cdot DY2 - SY2 \cdot DX2) / (SX2 - DX2) \\
 &(2)
 \end{aligned}$$

[0043] また、再構成画像内の特定のパターンやマークの像AのZ方向の位置であるOZは、上述した式（１），（２）より求められたOXの値を用いて、次式（３）により求めることができる。

$$\begin{aligned}
 [0044] \quad OZ &= (SZ1 - DZ1) / (SX1 - DX1) \cdot (OX - DX1) \\
 &(3)
 \end{aligned}$$

[0045] このように、この第２の実施形態の基板検査面検出処理S12においては、ステップS10で取得された複数の透過画像から、基板上の検査位置（再構成画像における検査面画像）を特定する、具体的には、透過画像において特定のパターンやマークの透過像の形状をイメージマッチング等で検出し、その位置から上述の式を用いて再構成画像内のパターンやマークの位置を決定して検査面画像を特定することにより、正確な位置の検査面画像（断面画像）を用いて検査を行うことができる。また、検査位置（検査面画像）を３次元画像（再構成画像）全体から特定するのではなく、より少ないデータ量の透過画像から特定しているため、特定のための時間が短くなり、結果として検査時間全体を短くすることができる。なお、検査対象が複数箇所ある場合は、それぞれの検査箇所または検査箇所近傍の特定のパターンやマークの形状（透過像の形状）を登録しておき、それぞれについてイメージマッチングで透過画像における位置を特定することにより、再構成画像における位置（検査面画像）も特定することができる。

[0046] なお、３点の特定のパターンやマークの位置を参照することにより、Z方

向のみではなく、XY方向の位置およびXYZ軸に対する回転を考慮して擬似断面画像を生成することができる。さらに、4点以上の特定のパターンやマークの位置を参照し、線形補間、放物線補間、キュービック補間などの既知の補間方法を用いることにより、対象物のたわみを考慮した擬似断面画像を生成することができる。

[0047] (第3の実施形態)

第1及び第2の実施形態では、図3に示すように、ステップS10で透過画像を撮影したのち、再構成画像を生成し、ステップS12で、透過画像若しくは再構成画像を用いて基板検査面を特定していたが、第3の実施形態では、図7に示すように、透過画像から再構成空間内における検査位置(基板検査面)を特定し、特定された位置を含む再構成画像(特定のパターンやマークを含む再構成画像)を再構成する構成である。

[0048] 図8は、この第3の実施形態におけるはんだの接合状態を検査するフローチャートを示しており、上述した処理と同じ処理は同じ符号を付すことにより詳細な説明は省略する。制御部10は、検査が開始されると、上述したように、放射線発生器駆動部16により放射線発生器22により放射される放射線の照射野を設定し、基板保持部駆動部18により基板保持部24を移動させるとともに、検出器駆動部20により検出器26を移動させて撮像位置を変更しながら、線質変更部14により放射線発生器22の線質を設定して放射線を基板に照射して透過画像を撮像する(ステップS11)。次に、これらの透過画像を用いて、第2の実施形態で説明したように、これらの透過画像における検査対象の像の位置をイメージマッチング等で特定し、このようにして特定された位置から、再構成空間(再構成画像)における位置を特定する(ステップS12)。そして、ステップS12で特定された位置が含まれる再構成画像(検査面画像または断面画像)を生成する(ステップS13)。この再構成画像によるはんだの接合状態の検査は、上述した通りである(ステップS14~S28)。

[0049] この第3の実施形態によると、再構成画像の生成は、検査対象が含まれる

部分に限定されるため、再構成画像のデータ量が小さくなり、これにより再構成画像の生成のための時間が短くなり、結果として検査時間全体を短くすることができる。

### 符号の説明

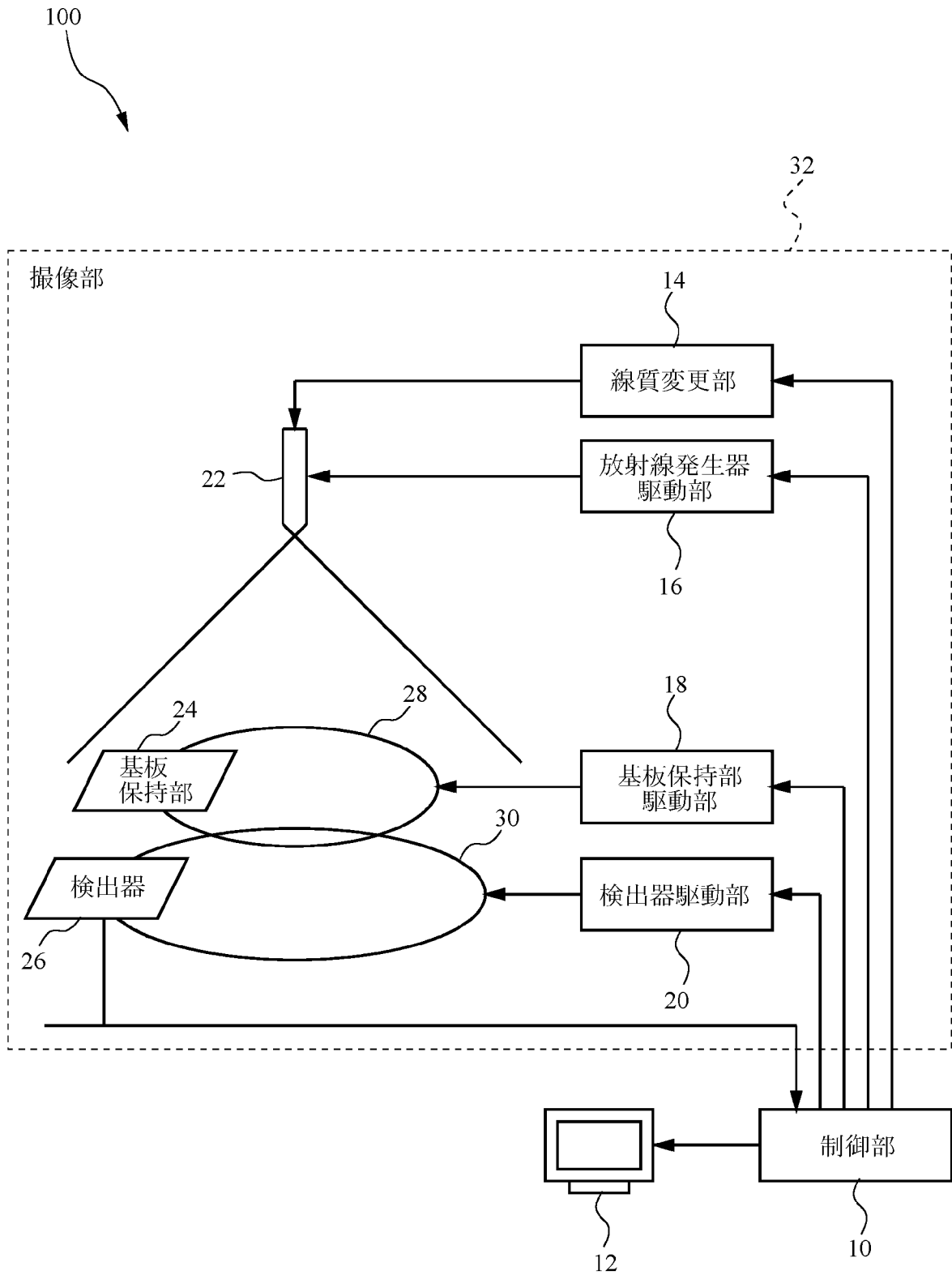
- [0050] 1 0 制御部  
3 4 記憶部  
1 0 0 検査装置

## 請求の範囲

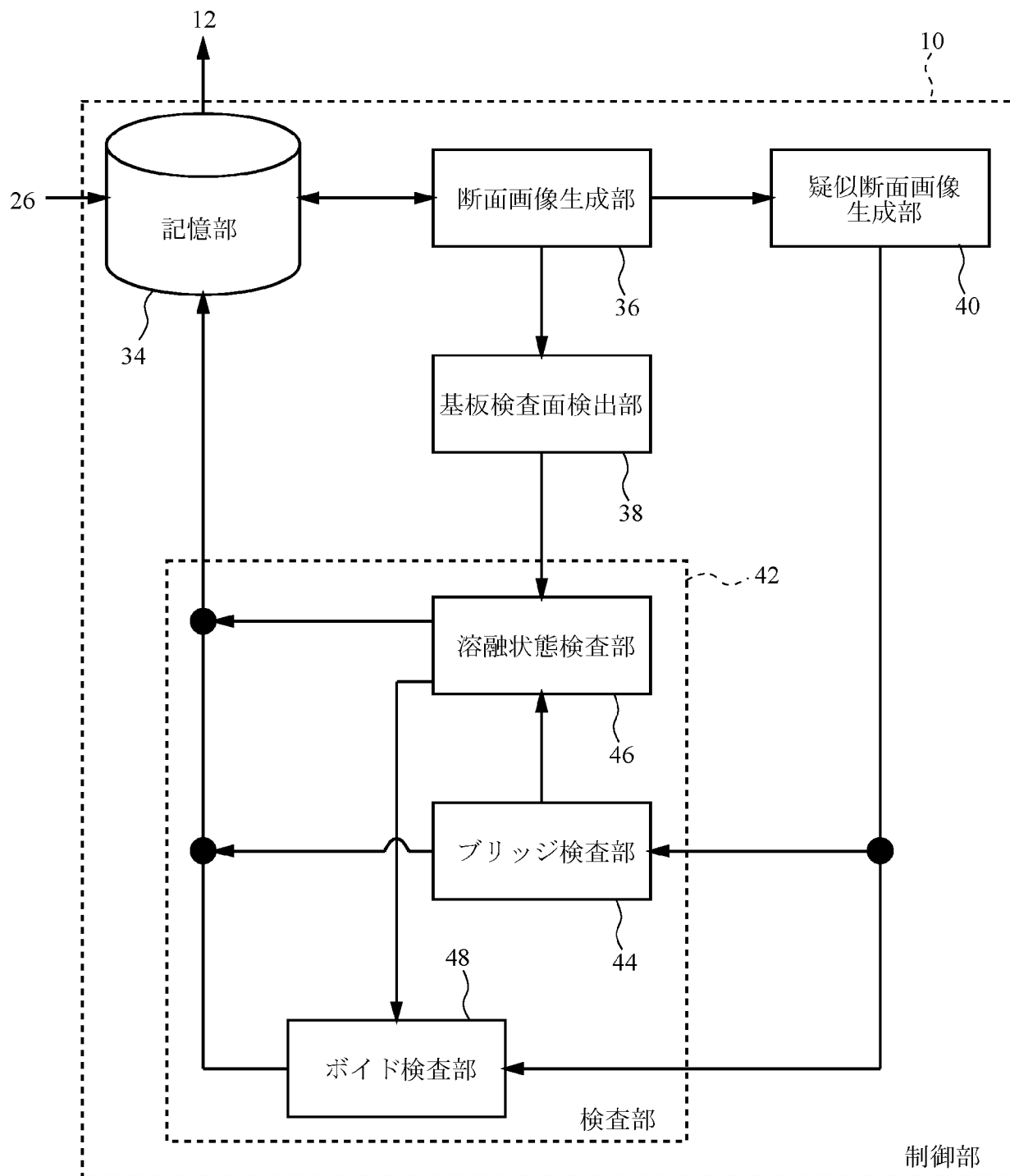
- [請求項1] 被検査体の放射線透過画像から生成された3次元画像における検査位置を特定する特定方法であって、  
前記放射線透過画像において、前記検査位置の透過像の位置を特定するステップと、  
前記透過像の位置から、前記3次元画像における前記検査位置を特定するステップと、を有することを特徴とする検査位置の特定方法。
- [請求項2] 前記透過像の位置を特定するステップは、前記検査位置または前記検査位置の近傍の特定のパターンやマークの透過像の形状を用いて特定することを特徴とする請求項1に記載の検査位置の特定方法。
- [請求項3] 前記放射線透過画像及び前記3次元画像を記憶する記憶部と、  
前記記憶部から前記放射線透過画像を取り出して、請求項1または2に記載の検査位置の特定方法により、前記3次元画像における前記検査位置を特定する制御部と、を有することを特徴とする検査装置。
- [請求項4] 被検査体の放射線透過画像から前記被検査体の3次元画像を生成する生成方法であって、  
前記放射線透過画像において、前記被検査体の検査位置の透過像の位置を特定するステップと、  
前記透過像の位置から、前記3次元画像における前記検査位置を特定するステップと、  
前記放射線透過画像から、前記検査位置を含む前記被検査体の3次元画像を生成するステップと、を有することを特徴とする3次元画像の生成方法。
- [請求項5] 前記透過像の位置を特定するステップは、前記検査位置または前記検査位置の近傍の特定のパターンやマークの透過像の形状を用いて特定することを特徴とする請求項4に記載の検査位置の特定方法。
- [請求項6] 前記放射線透過画像及び前記3次元画像を記憶する記憶部と、  
前記記憶部から前記放射線透過画像を取り出して、請求項4または

5に記載の3次元画像の生成方法により、前記被検査体の3次元画像を生成する制御部と、を有することを特徴とする検査装置。

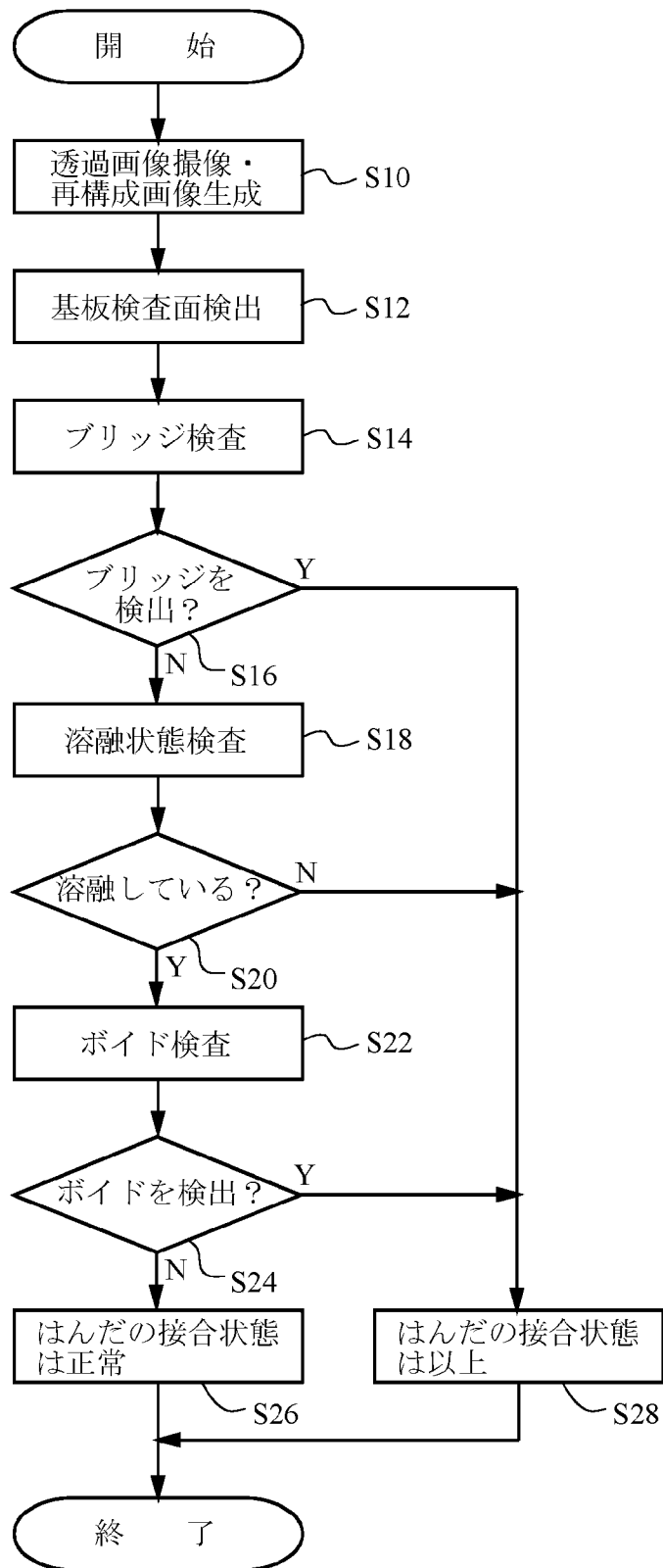
[図1]



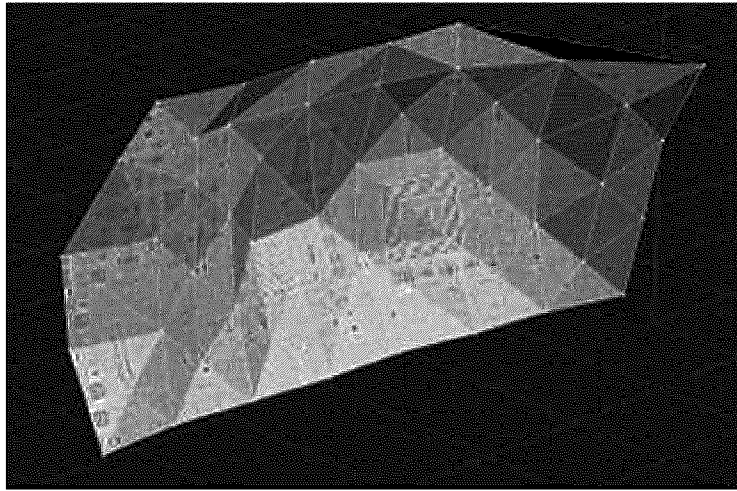
[図2]



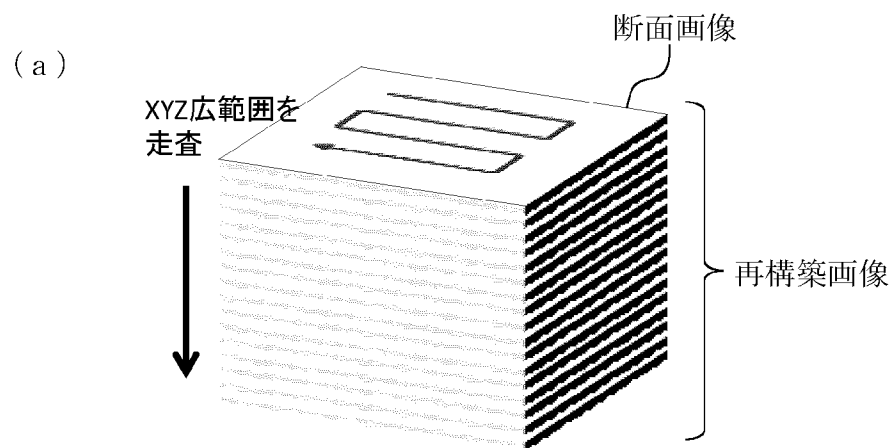
[図3]



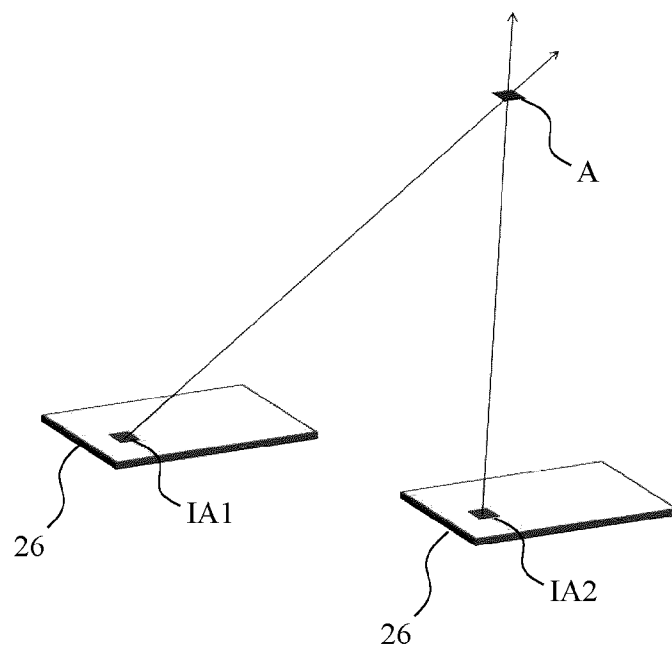
[図4]



[図5]

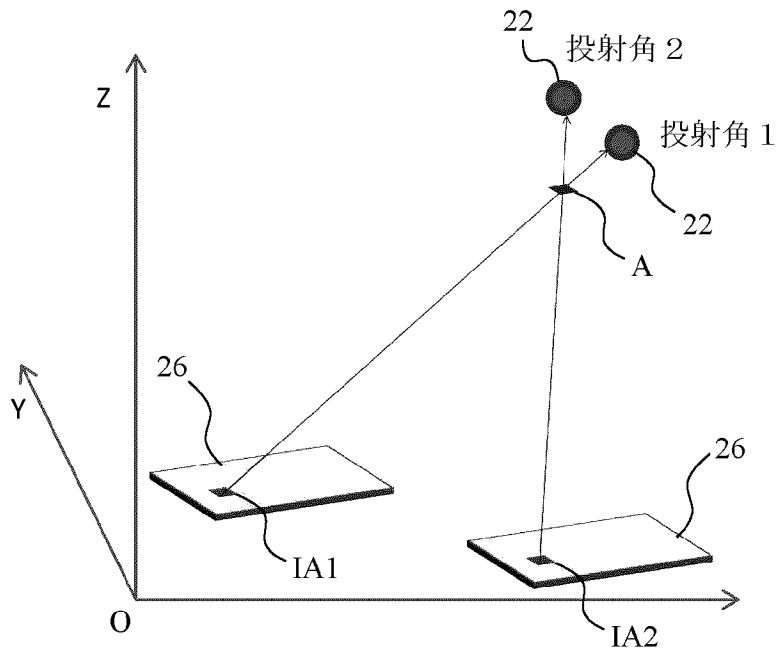


(b)

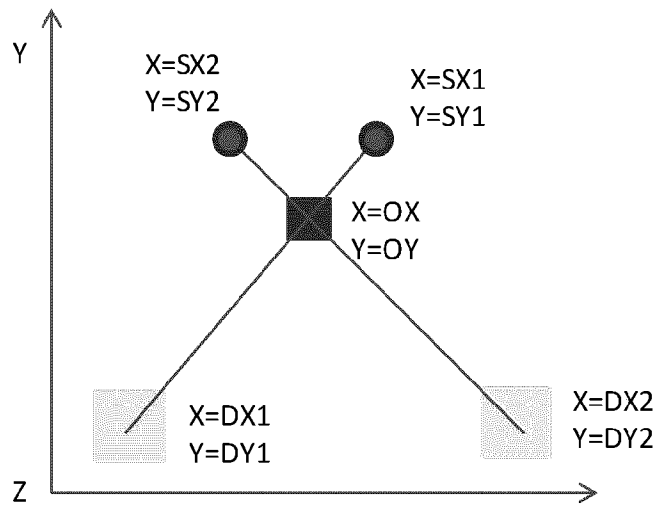


[図6]

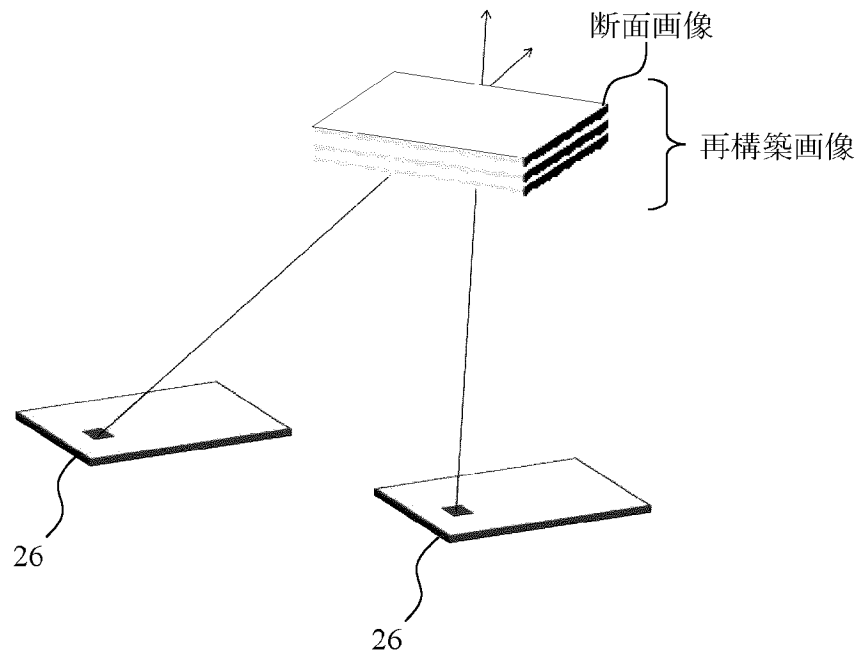
(a)



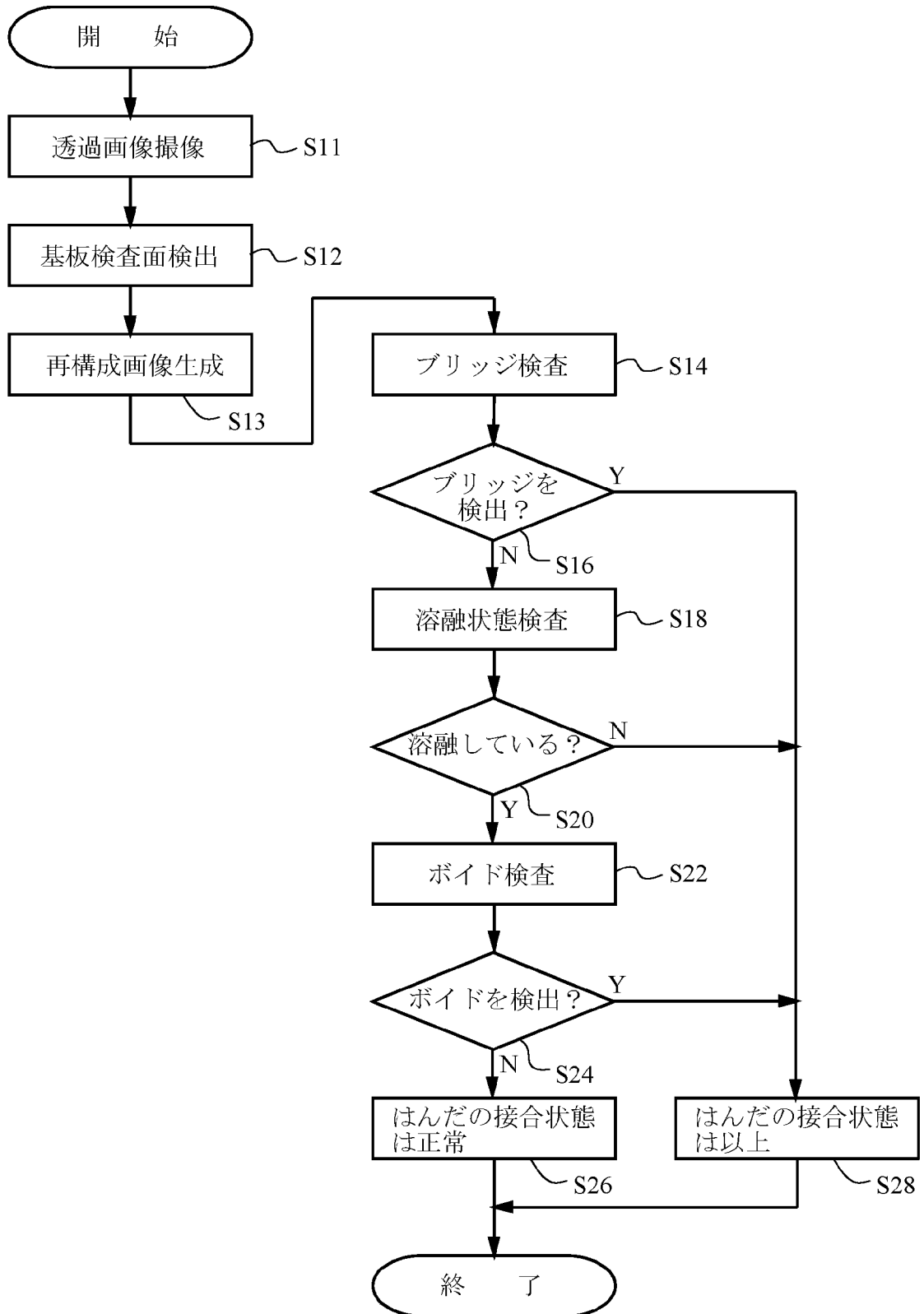
(b)



[図7]



[図8]



**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2018/035606

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**

Int.Cl. G01N23/046 (2018.01) i, G01N23/18 (2018.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. G01N23/046, G01N23/18

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2018
Registered utility model specifications of Japan	1996-2018
Published registered utility model applications of Japan	1994-2018

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2011-247588 A (HITACHI, LTD.) 08 December 2011, paragraphs [0009]-[0039], fig. 1-10 (Family: none)	1, 3-4, 6
X	JP 2005-233760 A (TOSHIBA IT & CONTROL SYSTEMS CORPORATION) 02 September 2005, paragraphs [0028]-[0066], fig. 1-4 (Family: none)	1-6
A	JP 2011-149737 A (SAKI CORPORATION) 04 August 2011, entire text, all drawings & US 2012/0294508 A1 (whole document) & WO 2011/089657 A1	1-6
A	JP 2003-514233 A (NICOLET IMAGING SYSTEMS) 15 April 2003, entire text, all drawings & JP 2005-142584 A & JP 2008-216265 A & US 6996265 B1 (whole document) & US 7013038 B1 & US 2006/0188141 A1 & US 2008/0130983 A1 & WO 2001/035051 A2 & CA 2390068 A1 & CN 1409816 A	1-6

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date  
 “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  
 “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  
 “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  
 “&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
 11 December 2018 (11.12.2018)

Date of mailing of the international search report  
 25 December 2018 (25.12.2018)

Name and mailing address of the ISA/  
 Japan Patent Office  
 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,  
 Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer  
  
 Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））  
 Int.Cl. G01N23/046(2018.01)i, G01N23/18(2018.01)i

B. 調査を行った分野  
 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））  
 Int.Cl. G01N23/046, G01N23/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2018年
日本国実用新案登録公報	1996-2018年
日本国登録実用新案公報	1994-2018年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2011-247588 A（株式会社日立製作所）2011.12.08, 段落0009-0039、図1-10（ファミリーなし）	1, 3-4, 6
X	JP 2005-233760 A（東芝ITコントロールシステム株式会社）2005.09.02, 段落0028-0066、図1-4（ファミリーなし）	1-6

☑ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	「&」同一パテントファミリー文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	

国際調査を完了した日  
 11.12.2018

国際調査報告の発送日  
 25.12.2018

国際調査機関の名称及びあて先  
 日本国特許庁（ISA/J P）  
 郵便番号100-8915  
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員） 佐藤 仁美	2W	4073
電話番号 03-3581-1101 内線 3258		

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2011-149737 A (株式会社サキコーポレーション) 2011.08.04, 全文、全図 & US 2012/0294508 A1 (Whole Document) & WO 2011/089657 A1	1-6
A	JP 2003-514233 A (ニコレット イメージング システムズ) 2003.04.15, 全文、全図 & JP 2005-142584 A & JP 2008-216265 A & US 6996265 B1 (Whole Document) & US 7013038 B1 & US 2006/0188141 A1 & US 2008/0130983 A1 & WO 2001/035051 A2 & CA 2390068 A1 & CN 1409816 A	1-6